





Литиевое сцинтилляционное стекло для регистрации нейтронов Лабораторная методика изготовления и характеристики



В рамках программы Приоритет-2030

Кресло И.Е., в.н.с, ЛФВ МФТИ

Научная сессия секции ядерной физики ОФН РАН

Литиевое сцинтилляционное стекло

n + ⁶Li
$$\rightarrow \alpha$$
 (2.05 МэВ) + T (2.75 МэВ)

Области применения :

Экспериментальная физика частиц Ядерная физика Дозиметрия Нейтронография, в т.ч. быстропротекающих процессов Нейтронная дифрактометрия .. и многое другое.

Требования:

- максимальное содержание 6Li
- максимальный световыход от альфа-частицы и тритона
- максимальная прозрачность на длине волны сцинтилляции
- минимальная длина вспышки

Стандарт:

6Li:Ce3+ стекло GS20 (Scintacor (быв. AST), UK) Длина волны 395 нм 6.6% Li, 95% обогащение по ⁶Li, длительность вспышки 57 нс



Light propagation in a neutron detector based on 6 Li glass scintillator particles in an organic matrix; Journal of Applied Physics 124(12):124502

Лабораторная методика изготовления

Сплавление компонентов при 1000-1400 С (использовалась естественная смесь изотопов лития, с содержанием ⁶Li - 7.5%);

Тигель трехслойный из прессованного нитрида бора и карбида кремния

Нагрев в микроволновой печи (400-800 Вт), контроль температуры PtRh термопарой, пирометром, визуально;



8-10 циклов :

нагрев —

перемешивание —

дегазация под вакуумом (50 мбар).

Прекурсоры от компании «Особо Чистые Вещества» ochv.ru :

Si, SiO₂, Li_2CO_3 , Al_2O_3 , MgO, CeF₃

Примерный атомный состав стекла:

11Si + 4Al + Mg + 0.35Ce + 13Li + 36O + 1F (7.7 масс. % Li)

Лабораторная методика изготовления

Расплав выливается в контейнер из нитрида бора и остужается в течение З часов (~450 град/час)

Сформированная капля разрезается на пластины, затем на образцы, которые шлифуются и полируются.

Финальная полировка — пастой диоксида церия.







Измерение характеристик с использованием ФЭУ измерение световыхода опорного светового источника

Образец оптически стыкуется с ФЭУ (Hamamatsu R1355 @ 1900 B) ФЭУ калиброван с точностью ±5% (мВ/фотон)

Выходной импульс анализируется модулем АЦП на основе микросхемы DRS4 (Radec, PSI) Передача данных по USB

Частота дискретизации АЦП - до 6 GS/s (использовалась 1 GS/s), триггер по цифровому дискриминатору, окно импульса — 1024 нс CH1 Single waveform [Event #1]



Пишется для каждого импульса: полная форма



Измерение характеристик с использованием SiPM

Образец оптически стыкуется с SiPM (Hamamatsu S13360-6050VE, 6x6 mm, 14336 pix) (модуль с интегрированным источником смещения до 65В, усилителем-формирователем и прецизионным термометром)

Выходной импульс анализируется многоканальным спектрометром на базе АЦП AD9226 (65 МГц, 12 бит) под управлением ПЛИС GW1NR-9 (Китай)

Передача данных по Ethernet (100Mbit/s)

АЦП непрерывно тактируется 50 МГц, триггер по цифровому дискриминатору, окно импульса — 640ns (32 отсчета, два до триггера, 30 после).



ANALOGING		USB POW	ER 5V
GATE 3.3V	owinV6	and the second	
	SpectroG		
ETH	1. Carlos		

Пишется для каждого импульса: - пик (мВ)

- интеграл (мВ*нс)



Литиевое сцинтилляционное стекло Исследованные образцы

GS20 (Scintacor/StGobain) :

GS20А толщ. 1.05 мм, вес 97 мг

GS20C толщ. 1.05 мм, вес 37 мг

К-серия (МФТИ) :

К734D толщ. 0.95 мм, вес 73 мг

К734G толщ. 0.95 мм, вес 20 мг







Сцинтилляция от источника ²⁴¹Am/Rh (4.5 МэВ α) образец K734D Фотодетектор : ФЭУ Hamamatsu R1355 @ 1900V



Сцинтилляция от источника ¹³⁷Cs (0.662 МэВ у) образец К734D Фотодетектор : ФЭУ Hamamatsu R1355 @ 1900V



Измерения на ЭИС Нейтрон ИФВЭ Геометрия и характеристики нейтронного источника

Канал быстрого вывода ускорителя У-70

Протоны Е _ _ _ 50-60 ГэВ на вольфрамовую мишень,

Цикл ускорителя ~ 8.8с, 1-3 сгустка за цикл, ~10¹¹ протонов в сгустке, длительность сгустка несколько нс, от 0.7 до 3 мкс между сгустками.

Замедлитель — полиэтилен

Детектор — 15.2 метра от мишени по горизонтали, выше оси нейтронного пучка на 4.76 м



 $10^{-8} 10^{-7} 10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-5}$

 $10^{2} 10^{3}$

10

10

Измерения на ЭИС Нейтрон Образец К734D

(SiPM с калибровкой по опорному световому источнику)

- с оптическим аттенюатором (пленка)
 - → коэффициент ослабления 2.8±0.2
- верхняя поверхность в оптическом контакте с тефлоновым отражателем



Измерения на ЭИС Нейтрон Образец K734D в кадмиевом экране

- с оптическим аттенюатором (пленка)
 - → коэффициент ослабления 2.8±0.2
- верхняя поверхность в оптическом контакте с тефлоновым отражателем



Кадмиевый экран (толщина 1.0 мм) существенно поглощает тепловые нейтроны.

Измерения на ЭИС Нейтрон Образец К734G

- с оптическим аттенюатором (пленка)
 - → коэффициент ослабления 2.8±0.2 ← доминирующая погрешность
- верхняя поверхность в оптическом контакте с черным светопоглотителем → полный световыход в 2 раза больше, чем измеряемый



Тест на ЭИС Нейтрон Образец К734D и стандарт GS20C — оценка эффективности регистрации нейтронов

Отношение по содержанию изотопа ⁶Li : 0.079 (GS20 - 95%, K734 — 7.5%)

Расчетное отношение эффективностей K734/GS20 0.079

Измеренное отношение эффективностей:

 $K734C/GS20C = 0.073 \pm 20\%$

 $K734G/GS20C = 0.068 \pm 20\%$

(доминирующая погрешность стабильность интенсивности пучка)

1 мм GS20 по спецификации имеет эффективность 75% (<0.025 эВ)

Для K734 пересчет дает ~**5.3%**

Выводы

Разработана масштабируемая лабораторная методика изготовления литиевого сцинтилляционного стекла на натуральной смеси изотопов лития, со световыходом **3900±280** фотонов/нейтрон и разрешением нейтронного пика **18%** на полувысоте;

Эффективность регистрации тепловых нейтронов - **5.3%** для толщины 1.05 мм - соответствует паспортной эффективности стекла GS20 пересчитанной по степени обогащения ⁶Li.

Дальнейшие планы

Изготовить стекло обогащенное по ⁶Li и ⁷Li, измерить характеристики;

Охарактеризовать нейтронный поток в точке расположения детектора одним из стандартных методов (например, калиброванным детектором ³Не в счетном режиме)

Измерить абсолютную эффективность обнаружения тепловых и быстрых нейтронов в широком спектре энергий, доступном на ЭИС Нейтрон;

Автор выражает благодарность за предоставленную возможность проведения данной работы и неоценимую помощь в проведении измерений:

НИЦ КИ ИФВЭ / МФТИ

ОИЯИ

Зайцеву А.М. Илюкину В.Л. Харлову Ю.В. Клещову А.М. Рыкалину В.И. Горину А.М. Денисову А.Г. Яновичу А.А. Дурум А.А. Уханову М.Н. Сухареву М.М. Купцову С.И.

Ольшевскому А.Г. Анфимову Н.В. Селюнину А.С. Рыбникову А.В. Ладыгину Е.А. Пономаренко Н.М.

При поддержке гранта в рамках программы Приоритет-2030

Детекторы тепловых нейтронов - процессы

n + ³He → T (573 кэB) + р (191 кэB)

n + ⁶Li → α (2.05 МэВ) + Т (2.75 МэВ)

- $\begin{array}{ll} \mathsf{n} + {}^{10}\mathsf{B} \rightarrow {}^{7}\mathsf{Li}^{*} + \alpha \rightarrow {}^{7}\mathsf{Li} \; (0.83 \; \mathsf{M} \ni \mathsf{B}) + \alpha \; (1.47 \; \mathsf{M} \ni \mathsf{B}) + \gamma \; (0.48 \; \mathsf{M} \ni \mathsf{B}) \\ & \rightarrow {}^{7}\mathsf{Li} \; (1.0 \; \mathsf{M} \ni \mathsf{B}) + \alpha \; (1.8 \; \mathsf{M} \ni \mathsf{B}) \end{array} \tag{93\%} \tag{93\%}$
- n + ¹⁵⁵Gd → ¹⁵⁶Gd* → ¹⁵⁶Gd + (γ-спектр + конверсионные электроны; 7.9 МэВ) (39-199 кэВ)
- n + ¹⁵⁷Gd → ¹⁵⁸Gd* → ¹⁵⁸Gd + (γ-спектр + конверсионные электроны; 8.5 МэВ) (29-182 кэВ)
- n + ²³⁵U \rightarrow фрагменты распада + 80 МэВ
- n + ²³⁹Pu \rightarrow фрагменты распада + 80 МэВ

	Изотоп	Агрегат- ное состояние	Сечение реакции, барн(1.8Å)	Длина своб. пробега n (λn)	Продукты реакции и их энергии (кэВ)		Приблизительный пробег частиц		
	³ He	газ	5330	70 мм.атм.	p: 573	T:191	3.8 мм.атм. С ₃ Н ₈		
	⁶ Li	TB.	940	230 мкм	T: 2750	α: 2055	130 мкм		
	$^{10}\mathbf{B}$	TB.	3840	20 мкм	α: 1472	⁷ Li: 830	3 мкм		
[${}^{10}\mathrm{BF}_{3}$	газ	3840	97 мм.атм.	α: 1472	⁷ Li: 830	4.2 мм.атм.		
	¹⁵⁵ Gd	TB.	49000	6.7 мкм	Конв. электроны: 39-199 Конв. электроны: 29-182		12 мкм		
	¹⁵⁷ Gd	TB.	254000	1.3 мкм			12 мкм		

Дмитрий Ильин, ФКС 2011 https://oiks.pnpi.spb.ru/archive/media/fks2011/llyin.pdf

Калибровка SiPM по опорному источнику

- 1. Изготовлен образец стекла с примесью тория и его ДПР (Т733Р);
- 2. Измерен его спектр на калиброванном ФЭУ Hamamatsu R1355 (0.63±5% pC/p.e.);
- 3. Вычислена средняя QE фотокатода ФЭУ по спектру излучения стекла (25.7%);
- 4. Вычислен световыход в фотонах на импульс для главного пика;
- 5. Получен аналогичный спектр на SiPM, вычислен коэффициент пересчета.



Измерение абсолютного световыхода на ²⁴¹Ат

1. Источник (²⁴¹Am с родиевым покрытием, ср. энергия α-частиц 4.5 МэВ);

2. Измерен спектр образца стекла на калиброванном ФЭУ Hamamatsu R1355 (0.63±5% pC/p.e., светосбор в 2π стерадиан);

3. Вычислена средняя QE фотокатода ФЭУ по спектру излучения стекла (25.7%);



4. Вычислен световыход в фотонах на импульс для пика (с фактором 2π → 4π);

255 pC \rightarrow

405 p.e. →

3150 фотонов в 4 π \rightarrow

700 фотонов / МэВ

Доминирующая погрешность 5% - калибровка ФЭУ

Измерения на ЭИС Нейтрон Образцы GS20



Характеристики SiPM S13660-6050VE

Structure

Darameter	Symbol	S13360					Unit
Parameter		-2050VE	-3050VE		-6050VE		Unit
Effective photosensitive area	-	2 × 2		6 × 6		mm	
Pixel pitch	-	50				μm	
Number of pixels	-	1584	3584		14336		-
Fill factor	-	74					
Package	-	Surface mount type					
Window	-	Epoxy resin					
Refractive index of window material	-	1.55					-

Electrical and optical characteristics (Ta=25 °C, Vover=3 V, unless otherwise noted)

Parameter		Sumbol	S13360					
		Symbol	-2050VE	-3050VE		-6050VE	Unic	
Spectral response range		λ			nm			
Peak sensitivity wav	elength	λр	450				nm	
Photon detection eff $(\lambda = \lambda p)^{*3}$	ficiency	PDE			%			
Dark count*4	Тур.		0.3	0.5		2	Mons	
	Max.] -	0.9	1.5		6	Mcps	
Terminal capacitance		Ct	140	320		1300	pF	
Gain	M 1.7 × 10 ⁶				-			
Breakdown voltage*5		VBR		53 ± 5			V	
Recommended operating voltage		Vop		VBR + 3			V	
Temperature coefficient of recommended operating voltage		ΔTVop		54			mV/°C	

*3: Photon detection efficiency does not include crosstalk or afterpulses.

*4: Threshold=0.5 p.e.

*5: If you have any requests of breakdown voltage selection, please feel free to contact us.

Note: The above characteristics were measured at the operating voltage that yields the listed gain.

(See the data attached to each product.)

Характеристики SiPM S13660-6050VE нелинейность



Спектр радиолюминесценции стекла

Среднее по спектру излучения

PDE ~ 34%

Npix=14336

$$N_{meas p.e.} = N_{pix} (1 - e^{-(N_{ph} / N_{pix})})$$



Характеристики SiPM S13660-6050VE Нелинейность модуля и DAQ



Характеристики SiPM S13660-6050VE Время восстановления



За длительность окна дигитайзера 640 нс потеря амплитуды сигнала < 2%